

第5回 半導体信頼性認定ガイドラインセミナー

～日本発、世界標準：車載・一般用途半導体部品認定ガイドラインの紹介～

『品質・信頼性を確保する新しい信頼性認定国際規格(IEC 60749-43)の紹介：
(半導体集積回路信頼性認定ガイドライン(EDR-4708B)
ミッションプロファイルに基づいた信頼性試験計画手順を追加)』

主催・企画： 一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体信頼性技術委員会

現在、車載用半導体集積回路の認定規格としてはAEC-Q100が良く知られていますが、AEC-Q100は摩耗故障に注目した過度な強度・寿命を追求する規格になっており、本質的な品質に関する観点が抜けているという課題があります。

また新興国の半導体の品質、信頼性レベルが不明確である車載用を含めた半導体部品の品質認定方法が分からない等の問題に対して、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)半導体信頼性技術委員会では、2011年4月にガイドラインとして「半導体集積回路信頼性認定ガイドライン(EDR-4708)」を制定し、国際標準化を進めてきました。

この度、本ガイドラインは、日本発の“国際標準化(IEC化)”に成功しました。今後は、半導体部品ユーザが製品に求める「高品質・高信頼性で安心できる製品供給」を少ない試験コスト、短い試験期間、既存試験データの有効活用で実現するためのガイドラインとして日本内外での利用が期待されます。ビジネスへのインパクトが注目される内容および、今後の展開動向について、次の通りセミナーを開催致します。多数のご参加を心よりお待ちしております。

日時

2017年10月27日(金) 13:00～17:00

会場

名古屋 愛知県産業労働センターウインクあいち #1207

Program

司会：伊賀洋一
[東芝半導体サービス&サポート(株)]

13:00～13:20	開会挨拶 瀬戸屋 孝 半導体信頼性技術委員会 主査 [東芝デバイス&ストレージ(株)]
13:20～14:00	本ガイドライン(EDR-4708)の概要と関連紹介 『日本発、IEC 60749-43の紹介とビジネスへのインパクト検証』 伊賀 洋一 半導体信頼性試験認定ワーキンググループ(WG) リーダ [東芝半導体サービス&サポート(株)]
14:00～14:50	本ガイドラインの詳細紹介『品質グレードと用途～摩耗故障』 村田 親一 認定WG特別委員 [新日本無線(株)]
14:50～15:00	休憩
15:00～15:50	本ガイドラインの詳細紹介『信頼性試験～解説』 宮川 高志 半導体信頼性サブコミティ(SC) リーダ [ルネサスエレクトロニクス(株)]
15:50～16:30	本ガイドラインと関係する規格(ED-4701/002)の紹介 『寿命試験の試験時間、試験個数の決定手順』とエクセルシートによる自動計算 (※エクセルシートは当該規格巻末の掲載URLからダウンロード可) 田中 政樹 半導体信頼性試験認定ワーキンググループ(WG) オブザーバ [一般財団法人日本電子部品信頼性センター]
16:30～16:50	質疑応答
16:50～17:00	閉会挨拶 伊賀 洋一 半導体信頼性試験認定ワーキンググループ(WG) リーダ [東芝半導体サービス&サポート(株)]

— 参加要領 —

■日 時 2017年10月27日(金) 13:00~17:00

■場 所 愛知県産業労働センター ウィンクあいち 1207
 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
<http://www.winc-aichi.jp/access/>

■申込期限 2017年10月20日(金) 必着

■定 員 50名(定員になり次第締め切らせて頂きます)

■申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込み下さい。登録完了後、「受講票」と「振込案内」をお送りいたします。

■参加費(税込)

JEITA会員 ¥20,000 (ガイドライン無し)

JEITA非会員 ¥25,000 (ガイドライン無し)

学 生 ¥3,000 (ガイドライン無し)

特別参加 ¥60,000 (ガイドラインEDR-4708B他(11冊)1セット込み、2名まで無料聴講可)



JEITA EDR-4708Bのセミナー開催特別頒布特典あり

※会員・非会員の区分は、下記にてご確認ください。(特別参加の場合、区分不要)

(URL) <http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>

※お申込み後のキャンセルはお断りさせていただいております。

※セミナーにて解説する内容をまとめた資料につきましては、当日に配布いたします。

※セミナー参加者向けの当該ガイドライン特別頒布価格を設定させていただいております。まだお持ちでない方は冊子の入手をお勧めいたします。ただし、専用申込書(別紙)でのお申込みに限りますのでご留意願います。

※セミナー終了後は、セミナー開催記念頒布価格とはなりませんので何卒ご了承ください。

※通常頒布URLはこちら → <http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard/search.cgi>

規格・ガイドライン 名称	番号	通常頒布価格	セミナー開催特別頒布価格
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(基本事項)	ED-4701/001A	3,291円	2,600円
寿命試験の試験時間, 試験個数の決定手順	ED-4701/002	4,968円	4,000円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験I)	ED-4701/100A	5,760円	4,600円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験II)	ED-4701/200A	3,909円	3,200円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(強度試験I-1)	ED-4701/301A	11,448円	9,200円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(強度試験I-2)	ED-4701/302	16,869円	13,500円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(強度試験II)	ED-4701/400A	5,554円	4,400円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(その他の試験)	ED-4701/500A	4,731円	3,800円
半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(個別半導体特有の試験)	ED-4701/600	4,114円	3,400円
半導体集積回路信頼性認定ガイドライン	EDR-4708B	9,936円	8,500円
個別半導体信頼性認定ガイドライン	EDR-4711A	8,208円	6,500円

(※通常頒布価格については、制定および改正時に変更となる場合もございますので予めご承知おきください。)

■お知らせ (今後の開催予定掲載先)

一般社団法人 電子情報技術産業協会 <http://www.jeita.or.jp/japanese/>

半導体信頼性技術委員会 <http://semiconjeitassc.jeita-sdte.com/srg/>

■運営事務局・各種問合せ先

(委員会担当事務局) 株式会社ティアテック JEITA信頼性セミナー運営事務局

〒135-0034 東京都江東区永代2-16-1 ティアテックビル

TEL 03-5875-9250 FAX 03-5875-9251 E-mail jeita@tiatech.com